

Europeiska patentverket avser att bevilja Medfield Diagnostics patent för system med självlärande klassificeringsalgoritm

Det europeiska patentverket, EPO, har idag har meddelat Medfield Diagnostics att man har för avsikt att godkänna (så kallad intent to grant) Medfield Diagnostics patentansökan gällande mikrovågstomografi, " LINEAR CLASSIFICATION OF MICROWAVE SCATTERING DATA", med ansökningsnummer EP20100742117. Patentet täcker framförallt Medfield Diagnostics nuvarande system med en självlärande klassificeringsalgoritm för att diagnosticera patienter.

Diagnostik med hjälp av självlärande klassificeringsalgoritmer, som tränas på mätdata från patienter och friska frivilliga, utgör grunden i Medfields unika teknik. Att detta patent nu beviljas är ett viktigt steg för Medfield, som nu erhåller ett långsiktigt skydd och en bas för vidare utveckling. Inom bolaget fortsätter vi att utveckla och förfinas denna teknik som redan idag används i kliniska studier, säger Carl Ekvall, VD i Medfield Diagnostics.

Frågor besvaras av Mikael Persson, Styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB på tel. 0703168161 eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com

Denna information är sådan information som Medfield Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017.

Läs som pdf